

材料技術講習会のご案内

異物対策・品質管理のための分析技術の向上について - 分析装置の特徴とその使い分け -

山梨県産業技術センター

金属製品や樹脂製品等の製造工程において、異物の混入や付着により製品品質を損ねてしまうようなトラブルに直面したことはありませんか。現場においては、異物の混入や付着ルートを速やかに特定し、品質管理の徹底を余儀なくされていることと思います。その際、有効な手段としてよく用いられるのが、X線や電子線を用いた分析です。しかし、その分析手法は蛍光X線分析(XRF)、電子線プローブアナライザ(EPMA)、X線光電子分光分析(XPS)、オージェ電子分光(AES)など様々な手法がありますが、試料の形態やサイズ、分析領域(面積や深さ)、および分析可能な元素範囲等が、それぞれの分析方法で異なるため、どの方法が最適なのか判断しづらい場合があります。

そこで本講習会では、各種分析方法の原理・特徴についてわかりやすく説明し、様々なケースでの最適な分析手法の選択・使い分けについて解説します。

○日時 平成**31**年**1**月**11**日(金) 午後**1:30** ~ 午後**3:30**

○会場 山梨県産業技術センター 甲府技術支援センター(〒400-0055 甲府市大津町 2094)
高度技術開発センター 2階 共同研究エリア3

○講師 日本電子株式会社
SA技術開発 島 政英 氏

○参加料 無 料

○申込 下記申込書にご記入の上、
ファックス (055-243-6110) またはメール (yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp) で
1月10日(木)までにお申し込みください。

○問合せ先 山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 工業材料科
TEL:055-243-6111 担当:佐野、阿部、石田、深澤

参加申込書

貴社名 _____ :
連絡ご担当者 _____ :
TEL _____ :

部署名	氏名

※申込みいただいた氏名等は、講師にお知らせいたしますことをご了承ください。